2 ЦЗЧЦЧЦЪ ₽РГРЦЧЦЪ ЦГ U Ц ԳРГ АРМЯНСКИЯ ХИМИЧЕСКИЯ ЖУРНАЛ

XXXIII, № 6, 1980

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 548.51

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ НАТРИЕВЫХ ЕРЕВАНИТОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СОДЫ

К. Б. ОГАНЕСЯН и К. Г. ГРИГОРЯН

Институт общей и неорганической химии АН Армячской ССР, Ереван

Поступило 1 VIII 1979

Изучен процесс кристаллизации натриевых ереванитов-25, -15, -10 и -4 (содусодержащие кремнеземы). Показано, что при $t < 800^{\circ}$ в ереванитах образуется а -кристобалит, а при $t > 1000^{\circ}$ имеет место совместное образование а-кристобалита н а-тридимита.

Рис. 4, библ. ссылок 16.

В работах [1, 2] исследовалось влияние термической обработки на текстуру натриевых ереванитов-25* и -10. В частности, было показано, что при термообработке ереванитов (200—1300°) спекание, кристаллизация и стеклование [5] проходят при более низких температурах по сравнению с тонкодиоперсными механическими смесями SiO₂ и соды аналогичных составов. При кристаллизации ереванитов отмечалось образование кристаллов различного габитуса.

Цель настоящей работы — идентифицировать эти кристаллические новообразования и выяснить влияние процентного содержания соды на процесс кристаллизации силикатных материалов. Исследовались ереваниты-25, -15, -10 и -4, которые, как было показано в [6], различаются не только количеством соды, входящим в состав силикатного материала, но и характером ее распределения в кремнеземе. В ереваните-25 сода находится в виде мелкокристаллических друз размером 1000—2000 A** (примерно 10%); столько же в состоянии содовой оболочки толщиной ~ 50 А, которая «склеивает» глобулы размером 50— 150 А в крупные корпускулы размером 400—800 А; примерно 2,3% Na₂O, эквивалентных ~ 4% соды, находится в состоянии ионной свя-

** А-ангстрем.

^{*} Натрневый ереванит-25 — новый силикатный материал [3], получаемый при комплексной переработке нефелиновых свенитов [4]. Цифра указывает на процентное содержание соды; остальное — аморфиая SiO₂ с S = 340 м²/г.

зи с поверхностными атомами кремния (-Si-ONa группировки) [6, 7]. В ереваните-15 свободнокристаллическая сода отсутствует; в остальном он аналогичен ереваниту-25. Ереванит-10 имеет мелкоглобулярное строение скелета с $D_{rs.} = 50-150$ А, поверхность которых покрыта содовой оболочкой толщиной ~ 20 А. В таком состоянии в образце находится примерно ~ 5% соды, а остальное количество натрия связано с поверхностными атомами кремния. В ереваните-4 имеются только поверхностные -Si-ONa группировки. Переход от ереванита-25 к ереванитам-15, -10 и -4, который отмечается при последовательном удалении ~ 10, 15 и 20% соды, сопровождается переходом крупнокорпускулярной структуры в глобулярную и ростом поверхности от 1.4 до 9.8; 17.4 и 340 x^2/z , соответственно.

О морфологических изменениях в структуре ереванита-25 при выведении отмеченных количеств соды можно судить по электронно-микроскопическим снимкам, представленным на рис. 1,1—4а.



Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки реплик натриевых ереванитов— 25 (1), —15 (2), —10 (3) и —4 (4) в исходном состоянии (а) и прогретых при 600 (б), 800 (s), 1000 (z) и 1300° (d).

Термическая обработка ереванитов, предварительно высушенных при комнатной температуре, проводилась при 200, 600, 800, 1000 и 1300° в течение 4 час. ($\Delta l = 7 \, граd/мин$). Полученные образцы исследовались методами электронной микроскопии [8] и рентгенофазового анализа (на дифрактометре ДРОН-1,5), межплоскостные расстояния определялись по таблицам [9]. В исходном состоянии и после прогрева при 200° все ереваниты рентгеноаморфны (за исключением ереванита-25, на дифрактограмме которого отмечались слабые пики, относящиеся к Na₂CO₃). Электронно-микроскопические снимки образцов, прогретых при 200°, подобны снимкам ереванитов в исходном состоянии, представленным на рис. 1,1—4а. При 600° в ереванитах-25, -15 и -10 отмечается образование кристаллической фазы (рис. 1,1—36) — призматические кристаллы, чаще всего спаянные в блоки, и небольшое число тонких игольча-



Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм натриевых ереванитов-25:4, термически обработанных при 600 (*a*), 800 (*б*), 1000 (*z*) и 1300° (*д*).

тых кристаллов, которые, в основном, наблюдались при просмотре реплик ераванита-25. На дифрактограммах образцов этой группы (рис. 2а) имеются пики со значениями da/n 4.02; 3.12 и 283 А, совпадающими со эначениями межплоскостных расстояний а-кристобалита, и очень слабые — 3,03; 2,51; 2,4!. COOTветствующие кристаллическому Na,SiO, (кристаллы в форме "игл" образуются в стекловидном метасиликате натрия при 550°) [10, 11]. Ереванит-4, прогретый при 600°, рентгеноаморфен. При этой температуре в ереваните-4 происходит лишь "срастание" глобул в агрегаты (рис. 1, 4б).

Призматические кристаллы, но в значительно больших количествах, наблюдаются на снимках ереванитов, прогретых при 800°.

В этих условнях кристаллизация отмечается и в ереваните-4 (рис. 1, 1— 4в). На дифрактограммах имеются интенсивные линии отражения, соответствующие межплоскостным расстояниям α -кристобалита (рис. 26). На дифрактограмме ереванита-25 имеется дополнительная, слабо выраженная группа пиков — 3,75; 3,18; 3,05; 2,63; 2,43 и 2,24 А, что свидетельствует об образовании небольщих количеств кристаллических Na₂Si₃O₇, α -Na₂Si₃O₇ и γ -Na₂Si₂O₅ [10]. Эти кристаллы также имеют форму «игл». Ереванит-25 представлен на рис. 1, 1в участком, на котором отмечается скопление таких крупных игольчатых кристаллов сложных силикатов натрия. В целом же для него характерна картина, наблюдаемая на рис. 1, 2в.

На дифрактограммах образцов ереванитов; прогретых при 1000° (рис. 2в), в угловом интервале 20 = 20 - 28° отмечается дополнительная группа пиков со значениями $d_*/n - 4,26$; 3,76; 3,21 А, совпадающая с табличными данными межплоскостных расстояний α -тридимита [10].

Судя по интенсивности основных пиков α-кристобалита и α-тридимита, при этой температуре в ереванитах-25, -15 и -10 образуется больше тридимита. На микрофотографиях сбразцов этой группы (рис. 1, 1— 4г), наряду с уже идентифицированными кристаллическими образовапиями, видны кристаллы гексагональной формы, единичные нли сросшиеся в своеобразные, радиально расходящиеся цепочки. При 1000° игольчатые кристаллы силикатоз натрия встречаются крайне редко.

Термическая обработка ереванитов-15, -10 и -4 при 1300° также приводит к образованию α-кристобалита и α-тридимита (рис. 2г). В ереваните-25 при этой температуре отмечается очень слабая кристаллизация и образуется только α-кристобалит (наблюдается смещение пиков, например, основного до 4,05 А; интенсивность примерно такая же, как при 600°). На снимке образцов этой группы (рис. 1, 1—4д) видна грубодисперсная структура, состоящая из крупных кристаллов и участков стекловидной массы (почти полное стеклование ереванита-25).



Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок реплики ереванита-10, прогретого при 1000°.

Анализ полученных результатов показывает, что процентное содержание соды в ереванитах определенным образом влияет на процесс кристаллизация и соотношение образующихся при этом кристаллических модификаций SiO₂. При больших содержаниях соды и высоких температурах прогрева, как правило, образуется болыше тридимита (ср. рис. 26, в). Судя по микрофотографии рис. 3, каждая из модификаций образуется в пределах ограниченной микрообласти (в левом нижнем утлу снимка видна «россыпь» кристаллов гексагональной формы α-тридимита, а в правом верхнем — сросшиеся кристаллы призматической формы кристобалита). И если кристаллы тридимита образуются и растут в объеме стекломассы, то для кристобалита характерно иное направление роста — от поверхности агрегатов наружу. На границах раздела микрообластей изредка отмечается совместное образование и рост кристаллов тридимита и кристобалита. Такие примеры можно наблюдать на рис. 1, 1г, 3г. Все это позволяет считать, что при термообработке ереванитов в указанном температурном интервале имеет место совместное образование кристобалита и тридимита, а не полиморфное превращение кристобалита в тридимит, как это имеет место в системе SiO₂+Na₂O [12, 13].

Интересно, что в противоположность [2], здесь не отмечается образования кварца. Очевидно, это связано с тем, что в [2] термообработке подвергался влажный ереванит-25 (образец, содержащий ~ 44% влаги, загружался в муфель при заданной температуре). В таких условиях вода может «заплавляться» внутри силикатного материала [14] и оказывать минерализирующее действие, приводя к образонанию прежде всего кварца [12, 15].



Рис. 4. Кривые зависимости интенсивности процесса кристаллизации натриевых ереванитов-25+4 от температуры и процентного содержания соды: 25 (1), 15 (2), 10 (3) и 4% (4).

На рис. 4 приведены кривые зависимости относительной интенсивности процесса кристаллизации ереванитов от *t* прогрева и содержания соды (натрия). За единицу отсчета принята интенсивность основного пика кристобалита образца ереванита-25, прогретого при 600°. При образовании двух кристаллических модификаций SiO₂ определялась суммарная интенсивность основных пиков. Как видно из графика, наибольшее количество кристаллической фазы образуется при 800° и больше всего при термической обработке ереванита-4. При всех *t* прогрева с уменьшением содержания соды в ереванитах увеличивается степень кристаллизации.

В [1, 2, 5] было локазано, что в ереванитах-25 и -10 уже при 300° имеет место твердофазное взаимодействие соды с кремнеземом, приводящее к замене содовой оболочки силикатной.

Твердофазному взаимодействию компонентов при температурах, намного меньших t_{nx} . отдельных компонентов, способствует тонкодисперсное, в основном на макро- и надмолекулярном уровнях, распределение соды в кремнеземе (дисперсность, которой, как было показано в [6], нельзя достигнуть при самом тщательном перемешивании или пропитке кремнезема содой). При твердофазном взаимодействии на

поверхности глобул кремнезема образуется силикатный расплав, в первую очередь, Na₂SiO₃. На поверхности контакта силикатный расплав—кремнезем—становится возможной ориентированная перестройка кремнекислородных тетраэдров, зарождение и рост кристаллической фазы (уменьшение вязкости SiO₂ в результате диффузии ионов натрия и разрыва Si—O—Si связей в структурной сетке кремнезема). Очевидно, что диффузия Na⁺ при 600° незначительна, т. к. при этой температуре образуется небольшое количество кристобалита — кристаллической модификации SiO₂, наиболее близкой по плотности к стеклообразному кремнезему. Поступление вещества, необходимого для роста кристаллов кристобалита, должно гроисходить из среды, богатой SiO₂, т. е. от глобул, что четко наблюдается на микрофотографиях. Судя по небольшому отклонению значений d_{α}/n , например, 4,02 вместо 4,03 A, кристаллическая решетка кристобалита, образующегося при 600°, несовершенна.

С ростом t прогрева до 800° отмечается образование большего количества кристобалита, что связано с увеличением толщины слоя повсрхностного расплава. Значения d_«/n кристобалита, образующегося при 800°, полностью отвечают значениям межплоскостных расстояний стандартного кристобалита.

При более высоких температурах (1000° и выше) отмечается переход ереванитов в состояние вязкотекучего расплава (рнс. 1, 1—г, д), в котором вследствие большого содержания натрия (переход всего натрия с поверхности глобул в объем) становится возможным образование тридимита. Совместное и независимое образование кристобалита и тридимита при $t \ge 1000^{\circ}$ (рис. 3), по-видимому, связано с тем, что в силикатном расплаве имеются области неодинакового химического состава — микрообласти, обогащенные ионом натрия, или более кислыс. В первых образуется тридимит, а во-вторых — кристобалит. Электронно-микроскопические снимки, указывающие на возможность такого расслаивания, были получены в [2].

Судя по микрофотографиям, при 1000° в ереванитах происходит, в основном, переход твердого вещества в стеклообразное состояние, что вызывает некоторое торможение кристаллизации. В последующем при завершении процесса стеклования кристаллизация вновь возрастает (рис. 4). Исключение составляет ереванит-25, в котором при всех t прогрева доминирующим является процесс стеклообразования, что связано с большим содержанием соды (отношение SiO₂/Na₂O = 3 -состав обычных стекольных шихт [11]). По этой же причине в ереваните-25 образуется больше кристаллических силикатов натрия — от мета- до трисиликата натрия (послойное увеличение SiO2 по мере взаимодействия Na2SiO3 с дополнительными количествами кремнезема $nNa_2O \cdot mSiO_2$). При $t > 1000^\circ$ в ереваните-25, по-видимому, образуется твердый раствор с кристобалитоподобной структурой, на что указывает некоторое уширение межплоскостных расстояний. Это может быть следствием диффузии ионов Na⁺ в кристобалит без перестройки его кристаллической решетки [12].

Армянский химический журнал, ХХХІЩ

46L

Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что основную роль при образовании кристаллической SiO2 играет Na+, который находится в состоянии химической связи с поверхностными атомами кремния, т. к. максимальная кристаллизация отмечается при термической обработке ереванита-4 и -10 (рис. 4). Действительно, если исходить из представлений, что на каждые 100 А предельно гидратированной поверхности SiO2 приходится 2,6 свободных ОН-групп [16], то, зная величину поверхности кремнезема, входящего в состав ереванитов (s = 340 м²/г), нетрудно определить, что в ереваните-4 болне половины всех свободных ОН-групп заменены на ONa, а в ереваните-10 имеет место полная замена. Остальная часть натрия, находящаяся в ереваните-10, образует на поверхности глобул оболочку толщиной не более 20 А. По сравнению с ними в ереванитах-25 и -15 имеется намного больше «избыточной» соды, особенно в ереваните-25-это и свободнокристаллическая сода, и содовая оболочка толщиной ~ 50 А. «Избыточная» сода способствует переходу силикатного материала в стеклообразное состояние тем раньше, чем больше се содержание.

Таким образом, термическая обработка ереванитов-25 ÷ 4 при t ≤ 800° сопровождается образованием кристобалита, а при t > 1000° имеет место совместное и независимое образование кристобалита и трпдимита, причем последний образуется в расплаве. Основную роль в процессе кристаллизации аморфной SiO₂, входящей в состав ереванитов, играет Na⁺, связанный с поверхностным атомом кремния.

ՍՈԴԱՅԻ ՏԱՐՔԵՐ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱՏՐԻՈՒՄԱԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻՏՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄԸ

4. P. 2በ**ՎՀԱՆՆԻՍՑԱՆ L 4. Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ**

Ուսումնասիրված է նատրիումական երևանիտների սոդա պարունակող ամոր\$ SiO-ի բյուրեղացման պրոցեսը սոդայի տարբեր քաղադրու**អ**յուններ պայմաններում, 3ույց է տրված, որ երևանիտների-25÷4 800° պայմաններում տեղի է ունենում α-կրիստոբալիտի առաջացում, t > 1000° պայմաններում միաժամանակ և Համատեղ առաջանում են α-կրիստոբալիտ և α-տրիդիմիտ, 3ույց է տրված, որ նատրիումական երևանիտների բյուրեղացման պրոցեսում Հիմնական դերը կատարում է նատրիումը, որը գտնվում է իոնական կապի մեջ մակերեսային Si ատոմների Հետ։ Սոդայի մնացած մասը առաջ է բերում սիլիկատային նյութի ապակեցում.

CRYSTALLIZATION OF SODIUM YEREVANITES WITH VARIOUS COMPOSITION OF SODIUM CARBONATE

K. B. OGANESSIAN and K. G. ORIGORIAN

The crystallization process of sodium yerevanite containing amorphous SiO₂ has been studied under a variety of soda composition. It has been

shown that at temperatures $t \ll 800^{\circ}$ crystallization with the formation of a-crystobalite takes place, while at temperatures $t > 1000^{\circ}$ simultaneous formation of a-crystobalite and a-tridymite was observed. It has been shown that soduim ions bonded with silicon atoms on the surface play a great role in the crystallization process of amorphous SiO₂. The remaining part of soda assists in the vitrification of the silicate material.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. М. Г. Манвелян, Э. Б. Оганесян, К. Б. Оганесян, М. С. Гаспарян, Изв. АН СССР, Неорг. матер., 14, 330 (1978).
- 2. М. Г. Минвелян, К. Б. Оганесян, Арм. хим. ж., 30, 882 (1977).

AN IN

- 3. М. Г. Манвелян, Тр. Всесоюзн. совещ. по химин и технологии глинозема, Ереван, 1964, стр. 421.
- 4. М. Г. Манвелян, Авт. свид. № 72427, Бюлл. изобр. № 2, 1948, стр. 8.
- 5. М. Г. Манвелян, К. А. Костанян, А. А. Маркарян, Изв. АН Арм. ССР, сер. хим., 16, 291 (1963).
- 6. М. Г. Манвелян, Э. Б. Оганесян, К. Б. Оганесян, М. С. Гаспарян, Арм. хнм. ж., 27, 458 (1974).
- 7. Э. Б. Оганесян, Б. С. Арутюнян, К. Б. Оганесян, Р. А. Абрамян, Арм. хим. ж., 29, 1011 (1976).
- 8. М. Г. Манвелян, Э. Б. Оганесян, К. Б. Оганесян, М. С. Гаспарян Арм. хим. ж., 26, 377 (1973).
- 9. Я. И. Гиллер, Таблицы межплоскостных расстояний, т. 2, Изд. «Наука», М., 1966. 10. Powder diffraction File, ACTM, 1969.
- 11. Б. И. Григорьев, А. А. Матвеев, Растворные стекло, Промстройнздат, М., 1956.
- 12. O. W. Florbe, Ber. Dtsch. Keram. Ges, 32, 369 (1955); 36, 89 (1961).
- 13. Н. П. Торопов, В. П. Барзаковский, Высокотемпературная химия силикатных и других окислов, Изд. АН СССР, М.—Л., 1963.
- 14. Р. Айлер, Коллондная химия кремнезема и силикатов, Изд. Строймат., М., 1959,. стр. 257.
- 15. А. В. Киселев, Ю. С. Никитин, Э. Б. Оганесян, Колл. ж., 40, 37 (1978).
- А. В. Киселев, В. И. Лыгин, Инфракрасные спектры поверхностных соединений, Изд. «Наука», М., 1973, стр. 93.